**2024年半导体材料标准工作会议预安排（按项目顺序排列）**

| **序号** | **标准名称** | **计划号** | **任务落实会** **（讨论会）****月份** | **预审会** **月份** | **审定会** **月份** | **应报批****时间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC203/SC2（半导体材料） |
|  | III族氮化物半导体材料中位错成像的测试 透射电子显微镜法 | 国标委发[2021]28号20214216-T-469 | — | — | 3 | 2024.4.13 |
|  | 硅片氧沉淀特性的测试 间隙氧含量减少法 | 国标委发[2023]58号20231107-T-469 | 4 | 7 | 10 | 2025.4.1 |
|  | 碳化硅单晶片微管密度测试方法 | 国标委发[2023]58号20231108-T-469 | - | 6 | 10 | 2025.4.1 |
|  | 太阳能级多晶硅 | 国标委发[2023]58号20231109-T-469 | - | 4 | 11 | 2025.4.1 |
|  | 半导体单晶材料透过率测试方法 | 国标委发[2023]58号20231111-T-469 | 4 | 11 | - | 2025.6.1 |
|  | 碳化硅单晶片厚度和平整度测试方法 | 国标委发[2023]58号20231112-T-469 | - | 6 | 10 | 2025.4.1 |
|  | 半导体晶片直径测试方法 | 国标委发[2023]58号20231113-T-469 | - | 4 | 10 | 2025.4.1 |
|  | LED外延芯片用砷化镓衬底 | 国标委发[2023]58号20231115-T-469 | 3 | 6 | 10 | 2025.4.1 |
|  | 非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法 | 国标委发[2023]64号20233951-T-610 | 4 | 7 | 10 | 2025.4.28 |
|  | 硅片径向电阻率变化的测量方法 | 国标委发[2023]64号20233945-T-610 | 4 | 7 | 10 | 2025.4.28 |
|  | 电子级三氯氢硅的化学气相沉积评价方法 | 工信厅科函[2022]94号2022-0080T-YS | - | - | 3 | 2024.4.29 |
|  | 多晶硅还原炉用氮化硅制品 | 工信厅科函[2022]94号2022-0081T-YS | - | - | 3 | 2024.4.29 |
|  | 颗粒硅表面粉尘含量的测定 浊度法 | 工信厅科函[2022]94号2022-0249T-YS | - | 3 | 4 | 2024.4.29 |
|  | 颗粒硅总金属杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 工信厅科函[2022]94号2022-0250T-YS | - | - | 3 | 2024.4.29 |
|  | 多晶硅生产用石墨制品表面杂质含量的测定 电感耦合等离子体光谱法 | 工信厅科函[2022]94号2022-0470T-YS | - | - | 3 | 2024.4.29 |
|  | 分子束外延（MBE）用高纯铝源 | 工信厅科函〔2022〕158号2022-0574T-YS | - | - | 3 | 2024.7.14 |
|  | 再生硅料 | 工信厅科函〔2022〕312号2022-2014T-YS | — | — | 4 | 2024.6.30 |
|  | 集成电路用四甲基硅烷 | 工信厅科〔2023〕18号2023-0001T-YS | - | 7 | - | 2025.4.17 |
|  | 半导体材料掺杂用扩散膜 | 工信厅科〔2023〕18号2023-0082T-YS | - | 7 | - | 2025.4.17 |
|  | 区熔用多晶硅材料 | 工信厅科〔2023〕18号2023-0083T-YS | - | 4 | 11 | 2025.4.17 |
|  | 质量分级及“领跑者”评价要求 高纯二氧化锗 | 中色协科字[2023]95号2023-035-T/CNIA | 3 | 8 | 10 | 2025.12 |
|  | 多晶硅生产用无水氯化铜 | 中色协科字[2023]95号2023-036-T/CNIA | 3 | 4 | 11 | 2025.12 |
|  | 绿色设计产品评价技术规范 高纯二氧化锗 | 中色协科字[2023]95号2023-037-T/CNIA | 3 | 8 | 10 | 2025.12 |
|  | 绿色设计产品评价技术规范 锗单晶和锗单晶片 | 中色协科字[2023]95号2023-038-T/CNIA | 3 | 8 | 10 | 2025.12 |
|  | 半导体洁净室 空气分子污染物（AMC）掺杂剂B和P测定 电感耦合等离子体质谱法 | 中色协科字[2023]95号2023-039-T/CNIA | 3 | 6 | 8 | 2025.12 |
|  | 半导体洁净室 水溶性空气分子污染物（AMC）的测定 离子色谱法 | 中色协科字[2023]95号2023-040-T/CNIA | 3 | 6 | 8 | 2025.12 |
|  | 蓝宝石晶体生长隔热用氧化锆纤维屏 | 中色协科字[2023]95号2023-041-T/CNIA | 3 | 6 | 8 | 2025.12 |
|  | 光伏用半片单晶硅片 | 中色协科字[2023]95号2023-042-T/CNIA | 4 | 7 | 11 | 2025.12 |